## فرآيندهاي تصادفي

نيمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱



گردآورندگان: هانیه احسانی اسکویی

دانشکدهی مهندسی کامپیوتر

آزمون فرض

آزمونک شماره ۷

## مسئلهي ١.

## حل.

(a) داده های موجود به شکل متناظر داده شده اند و میتوان از paired t-test استفاده کرد. آماره مورد استفاده در این آزمون برابر است با:

$$t = \frac{\overline{X}_D - \mu}{\frac{s_D}{\sqrt{n}}}$$

که در آن  $\overline{X}_D$  برابر میانگین اختلافها در هر ردیف داده است و  $s_D^{\mathsf{Y}}$  واریانس آن است. با جایگذاری داریم:

$$t = \frac{\frac{\Lambda}{9} - \frac{1}{9}}{\frac{9/200}{\sqrt{9}}} = 7/4$$

که با مقایسه این مقدار با مقدار متناظر  $\mathbf{9}$  درصد در جدل توزیع T،  $\mathbf{7}/\mathbf{7}$ ، فرض تاثیرگذار نبودن تراشه رد می شود.

(b) رابطه بازه اطمینان را مینویسیم:

$$- {\rm Y/PV} < t = \frac{\frac{\Lambda \cdot }{\hat{\cal F}} - \mu}{\frac{9/\Delta {\rm YT}}{\sqrt{\hat{\cal F}}}} < {\rm Y/\Delta V}$$

پس بازه اطمینان مورد نظر برابر است با [۳/۳۲۹, ۲۳/۳۳۷]. این بازه به این معنی است که به احتمال ۹۰ درصد بازه به دست آمده شامل مقدار واقعی میانگین اختلاف بین عمر دستگاه قبل و بعد از اضافه کردن تراشه است.

 $\triangleright$